



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

## 电子背散射衍射分析技术测试钴合金中科恩系数的方法

文献类型: 专利

**作者** 彭胜, 袁改焕, 王练, 李明远, 李阎平, 岳强, 李刚, 高博 and 庞丽侠

**发表日期** 2013-02-13

**专利国别** 中国

**专利类型** 发明专利

**权利人** 中国科学院金属研究所

**中文摘要** 本发明公开了电子背散射衍射分析技术测试钴合金中科恩系数的方法,通过制样、磨光、电解抛光、洗净后采用电子背散射衍射分析技术观察,通过单次测试标定率>90%,计算得到钴合金样品科恩系数。本发明测试速度快,处理简单,一次测试可获得三个方向的科恩系数,解决了无钴合金标样测试钴合金科恩系数的问题。

**公开日期** 2013-02-13

**语种** 中文

**专利申请号** CN102928449A

**源URL** [http://210.72.142.130/handle/321006/65928]

**专题** 金属研究所\_中国科学院金属研究所

**推荐引用方式** 彭胜, 袁改焕, 王练, 李明远, 李阎平, 岳强, 李刚, 高博 and 庞丽侠. 电子背散射衍射分析技术测试钴合金中科恩系数的方法. 2013-02-13.  
**GB/T 7714**

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览	下载	收藏
204	0	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。